# 第 15 回放射線による非破壊評価シンポジウム

**主　催**：(一社)日本非破壊検査協会　放射線部門
**協　賛**：依頼中
期　日：2026 年 3 月 2 日(月) 13：00～18：10　(受付 12：00～)
**会　場**：日本非破壊検査協会　亀戸センター6 階 B 会議室
東京都江東区亀戸 2-25-14 京阪亀戸ビル

| | | | |
|---|---|---|---|
| **参加費**：<br>(講演論文集<br>1 冊を含む) | JSNDI 正会員 | | 4、000 円 |
| | 登壇者 | | 4、000 円 |
| | 学生会員 | | 3、000 円 |
| | 協賛学会会員 | | 6、000 円 |
| | 非会員 | 一般 | 8、000 円 |
| | | 学生 | 4、000 円 |

申込方法：以下 Web 参加申込ページからお申込みください。
https://sciences.jsndi.jp/radiographic/
問合先：(一社)日本非破壊検査協会 放射線シンポジウム係
TEL：03-5609-4015　E-mail：yasoshima@jsndi.or.jp

講演時間：一般講演 30 分 発表 25 分、質疑応答 5 分
特別講演 40 分 発表 35 分、質疑応答 5 分

## ープログラムー

**開会挨拶**　(13:00～13:03)
放射線部門主査　富澤雅美（東芝ユニファイドテクノロジーズ(株)）

1. 一般講演: 放射線による非破壊検査　(13:03～15:05)
座長　田北雅彦((株)IHI 検査計測)
1-1　熱交換器管端溶接部の内在きずへの X 線透過試験と中性子線 CT 法の適用
新日本非破壊検査(株)　○今川幸久

1-2　Ir-192 球状線源とディスク状線源の像質比較試験
(一社)日本非破壊検査協会 大岡紀一
(株)千代田テクノル ○石井　貴
(株)IHI 検査計測 田北雅彦

1-3　Se-75 線源の配管撮影への適用（フィルム編）
ポニー工業（株）　○水野　優、羽部達矢
(一社)日本非破壊検査協会 大岡紀一
ポニー工業(株) 釜田敏光

1-4　Se-75 線源の配管撮影への適用（ベンダブル DDA 編）
ポニー工業(株) ○羽部達矢、水野　優
(一社)日本非破壊検査協会 大岡紀一
ポニー工業(株) 釜田敏光

休憩（15:05～15:13）

2. 特別講演　(15:13～15:55)
座長　富澤雅美（東芝ユニファイドテクノロジーズ(株)）
2-1　トレーラー搭載可搬型小型中性子源システム RANS-III の現状と今後－予防保全の実現を目指す中性子線による非破壊計測技術と装置開発－
(国研)理化学研究所 ○大竹淑恵、小林知洋
池田裕二郎、今城想平
草野広樹、水田真紀
東京科学大学 池田翔太

休憩（15:55～16:03）

3.一般講演:X 線による非破壊検査　(16:03～18:05)
座長　富澤雅美（東芝ユニファイドテクノロジーズ(株)）
3-1　CAD モデルを用いた X 線マイクロ CT 用金属アーチファクト低減
(株)島津製作所 ○森本直樹
陳　澤政、小林哲哉
謝　志敏、小島佳奈
高橋　亮、欅　泰行

3-2　ISO 規格に基づく幾何学的不鮮鋭度 Ug および RT-D における基本空間分解能 SRb の関係に関する考察
富士フイルム(株) ○成川康則

3-3　高エネルギーX 線撮像に基づくコンクリート内部構造評価手法の高度化
東京大学 ○馬　昭、杉田彰夫
安倍昌宏、神近祐平、長谷川秀一
(株)高速道路総合技術研究所 宮永憲一
守口良平、藤田恭介
中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋(株) 小塚正博

3-4　機械学習を活用した高エネルギーX 線による橋梁内部の認識手法についての検討
東京大学 ○神近祐平、杉田彰夫
安倍昌宏、 馬　昭、長谷川秀一
(株)高速道路総合技術研究所 宮永憲一
守口良平、藤田恭介
中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋(株) 小塚正博

**閉会挨拶**　(18:05～18:10)
富澤雅美（東芝ユニファイドテクノロジーズ(株)）

講演中のカメラやスマートフォン等による撮影は原則禁止としております。撮影される場合は、事前に登壇者の了承を得た上で、登壇前に座長へ申し出るようにお願いいたします。

**会場地図**